
Rasterelektronenmikroskop

Prinzip:

Abbildung bei hohen Vergrößerungen und Elementanalyse.

Hersteller	Carl Zeiss NTS GmbH
Elektronenquelle	Wolframglühkathode
Beschleunigungsspannung	200 - 30 000 V
Auflösung	max. 3 nm bei 30 kV
Vakuum	10^{-7} - 10^{-6} mbar
Detektoren	SE, BSE
EDX-Detektor	10 mm ² Si(Li)
Analysierbare Elemente	ab Be
Analysemöglichkeiten	Punkt, Linie, Fläche
Max. Probenmasse	2 kg
Probenanzahl	max. 9